

# Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

17.11.2017

Prüfungsamt

## Studienrichtung: Mikroelektronik

Prüfungsablaufplan für das WS 17/18

Studienjahrgang 2013 / 9. Semester

vorläufiger Plan

in der Prüfungsperiode vom 05.02.2018 - 03.03.2018

(vorbehaltlich weiterer Ergänzungen und Veränderungen)

Prüfungsfach	Prüfungs-termin	Prüfer
<b><u>Wahlpflichtfächer:</u></b>		
Physikalische Mikroanalytik / Schicht-/HL-Messtechnik 87310 12 12 05 (Modul Char. von Mikrostrukturen)	n. Vereinb.	Prof. Bartha/Prof. Richter
OS Mikroelektronik - Referat 92110 12 12 08	n. Vereinb.	Prof. Bartha / Prof. Richter
OS Mikroelektronik - Beleg 92120 12 12 08	n. Vereinb.	Prof. Bartha / Prof. Richter
Solarenergietechnik / Dünne Schichten / Vakuum 86110 12 12 03 (Modul Ang. Dünnschicht- und Solartechnik)	n. Vereinb. SS	Prof. Bartha
VLSI-Prozessorwurf - Projektarbeit 78110 12 08 19	n. Vereinb.	Prof. Mayr
VLSI-Prozessorwurf - Referat 78120 12 08 19	n. Vereinb.	Prof. Mayr
Sensorik II / Biochem. Sensoren / IR-Messt. - Prüfung 86910 12 11 04 (Modul Sensoren und Sensorsysteme)	07.02.	Prof. Gerlach/Dr. Günther
Sensorik II / Biochem. Sensoren / IR-Messt.- Laborpraktikum 86930 12 11 04 (Modul Sensoren und Sensorsysteme)	n. Vereinb.	Prof. Gerlach/Dr. Günther
Plasmatechnik 87110 12 11 05	16.02.	Prof. Gerlach
Unkonv. Aktoren / Mikrofluidik - Prüfung 87510 12 12 06 (Modul Neue Aktoren und Aktorsysteme)	n. Vereinb.	Prof. Richter
Unkonv. Aktoren / Mikrofluidik - Referat 87520 12 12 06 (Modul Neue Aktoren und Aktorsysteme)	n. Vereinb.	Prof. Richter
Unkonv. Aktoren / Mikrofluidik - Laborpraktikum 87530 12 12 06 (Modul Neue Aktoren und Aktorsysteme)	n. Vereinb.	Prof. Richter
Innovative Konzepte für aktive Bauelemente der Nanoelektronik - Prüfung Innov. Semiconductor Devices 87750 12 12 07	n. Vereinb.	Prof. Mikolajick
Innovative Konzepte für aktive Bauelemente der Nanoelektronik - Prüfung Materials for Nanoelectronics 87740 12 12 07	n. Vereinb.	Prof. Richter
Innovative Konzepte für aktive Bauelemente der Nanoelektronik - Beleg (Protokolle) 87760 12 12 07	n. Vereinb.	Prof. Richter

Speichertechnologie 86320 12 12 04	n. Vereinb.	Prof. Mikolajick
Modellierung und Charakterisierung nanoelektronischer Bauelemente (Klausur) 155310 12 08 26	14.02.	Prof. Schröter
Charakterisierung und Modellierung nanoelektronischer Bauelemente (Belegarbeit) 155320 12 08 26	n. Vereinb.	Prof. Schröter
OS Mikro-Nanoelektronik 12 08 25 Referat 92510	n. Vereinb.	Prof. Schröter
OS Mikro-Nanoelektronik 12 08 25 Beleg 92520	n. Vereinb.	Prof. Schröter
<b>Nach- und Wiederholungsprüfungen</b>		
Theor. Elektrotechnik II 31020 11210 (05)	28.02.	Dr. Jacobs Prof. Krauthäuser
Theor. Elektrodynamik (Master) 31030	28.02.	Dr. Jacobs Prof. Krauthäuser
Physik ausgew. Bauelemente (Num. Bauelementesim. + Modellierung für den Schaltungsentwurf) 49610	08.02.	Prof. Schröter
Mikrosystem- und Halbleitertechnologie ( Mikrosysteme, Werkstoffe, HL-Technologie, Sensorik)  Prüfung 1 49010 (MST/Sensor.) Prüfung 2 49020 (Werkst./HLT)	SS 18  mündlich n. Vereinb.	Prof. Richter/Prof. Gerlach/Prof. Bartha Prof. Richter
Schaltkreis- und Systementwurf (Beleg) 49810	n. Vereinb.	Prof. Mayr

(05)

PO-Version

Prof. Dr.-Ing. St. Bernet  
Vorsitzender des Prüfungsausschusses